



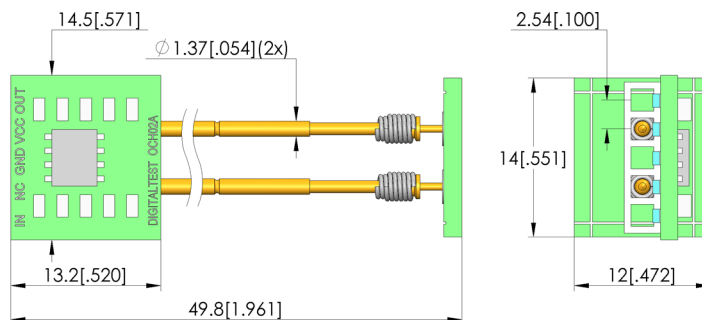
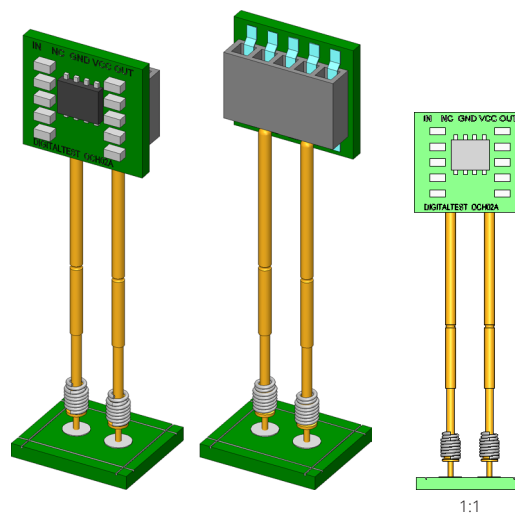
- Componentes para opens test, para prueba capacitiva de chips semiconductores por rupturas, cortocircuitos y errores de soldadura
- Adecuado para sistemas de prueba Digitaltest

### Utilización

La sonda de prueba OpensCheck se utiliza para pruebas capacitivas de circuitos integrados, para probar las conexiones unidas por cables al interior de un circuito integrado respecto a roturas, cortocircuitos y errores de soldadura

### Volumen de suministro

Placa de electrónica, placa de sensor y puntas de prueba GKS-925 T JA 1000-S.



### Datos generales

Grupo de productos:	Opens Test
Serie:	OTU
Tipo:	Digitaltest opens test
Modelo:	
Tipo de accesorios:	Accesorios customizados
Estado de entrega:	Placa de electrónica, placa de sensor, GKS
Ancho:	12 mm
Altura:	49,8 mm
Peso:	0,01 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):

VA xxxx/MTSxxx

### Datos técnicos

Carrera:	5 mm
Fuerza de resorte:	1 N
Longitud:	14 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl):	12 x 14 x 49,8 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

